

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ В.Ф. УТКИНА"**

СОГЛАСОВАНО
Зав. выпускающей кафедры

УТВЕРЖДАЮ

**Методы исследования состава и структуры
поверхности**
рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой	Промышленной электроники
Учебный план	v11.04.04_26_00.plx 11.04.04 Электроника и наноэлектроника
Квалификация	магистр
Форма обучения	очно-заочная
Общая трудоемкость	4 ЗЕТ

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	2 (1.2)		Итого	
Неделя	16			
Вид занятий	уп	рп	уп	рп
Лекции	16	16	16	16
Лабораторные	8	8	8	8
Практические	16	16	16	16
Иная контактная работа	0,35	0,35	0,35	0,35
Консультирование перед экзаменом и практикой	2	2	2	2
Итого ауд.	42,35	42,35	42,35	42,35
Контактная работа	42,35	42,35	42,35	42,35
Сам. работа	57	57	57	57
Часы на контроль	44,65	44,65	44,65	44,65
Итого	144	144	144	144

г. Рязань

Программу составил(и):

к.т.н., доц., Гололобов Геннадий Петрович

Рабочая программа дисциплины

Методы исследования состава и структуры поверхности

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

ФГОС ВО - магистратура по направлению подготовки 11.04.04 Электроника и нанoeлектроника (приказ Минобрнауки России от 22.09.2017 г. № 959)

составлена на основании учебного плана:

11.04.04 Электроника и нанoeлектроника

утвержденного учёным советом вуза от 30.01.2026 протокол № 7.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Промышленной электроники

Протокол от 21.05.2026 г. № 11

Срок действия программы: 2026-2028 уч.г.

Зав. кафедрой Круглов Сергей Александрович

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2027-2028 учебном году на заседании кафедры
Промышленной электроники

Протокол от ____ 2027 г. № ____

Зав. кафедрой _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2028-2029 учебном году на заседании кафедры
Промышленной электроники

Протокол от ____ 2028 г. № ____

Зав. кафедрой _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2029-2030 учебном году на заседании кафедры
Промышленной электроники

Протокол от ____ 2029 г. № ____

Зав. кафедрой _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2030-2031 учебном году на заседании кафедры

Промышленной электроники

Протокол от ____ 2030 г. № ____

Зав. кафедрой _____

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
1.1	Целью освоения дисциплины «Методы исследования состава и структуры поверхности» является формирование у будущих специалистов твердых теоретических знаний и практических навыков в части изучения основ электрохимических и физико-химических методов анализа поверхности металлов и сплавов применительно к химии, теоретической и прикладной электрохимии, материаловедению; в выработке умения выбрать оптимальную методику анализа и грамотно оценить полученный результат.
1.2	Задачи дисциплины:
1.3	1) получение и закрепление теоретических и практических знаний в области физических и физико-химических явлений и процессов, лежащих в основе наиболее важных методов исследования состава, структуры и свойств материалов и покрытий и явлений в них;
1.4	2) понимание принципов устройства и работы типовых приборов и аппаратуры, используемых в данных методах, способов приготовления и подготовки образцов, обработки и анализа регистрируемых характеристик и источников возможных ошибок, определения точности экспериментов и их ограничений;
1.5	3) приобретение знаний и навыков по оценке возможностей методов и их практическому использованию в исследовании материалов и покрытий различной природы, процессов и явлений в них.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Цикл (раздел) ОП:	Б1.В.ДВ.01
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1	Высоковольтная импульсная техника
2.2.2	Научно-исследовательская работа (часть 2)
2.2.3	Производственная практика
2.2.4	Современные методы анализа в научных исследованиях
2.2.5	Физические основы технологии производства приборов и устройств электроники
2.2.6	Электронные системы коммуникации и управления
2.2.7	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.8	Преддипломная практика
2.2.9	Современные технологии производства электронных устройств

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
ПК-2: Способен формировать новые направления научных исследований и опытно-конструкторских разработок	
ПК-2.1. Проведит анализ новых направлений исследований в соответствующей области знаний	
Знать Основные методы и средства проведения экспериментальных исследований, системы стандартизации и сертификации.	
Уметь Выбирать способы и средства измерений и проводить экспериментальные исследования.	
Владеть Способами обработки и представления полученных данных и оценки погрешности результатов измерений.	
ПК-2.2. Проводит обоснование перспектив проведения исследований в соответствующей области знаний	
Знать Методы и способы разработки технических заданий для проектирования технологических процессов производства материалов и изделий электронной техники.	
Уметь Применять методы разработки технических заданий для проектирования технологических процессов производства материалов и изделий электронной техники.	
Владеть Навыками по применению методов и способов разработки технических заданий для проектирования технологических процессов производства материалов и изделий электронной техники.	

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	Знать основные методы и средства проведения экспериментальных исследований, системы стандартизации и сертификации.
3.2	Уметь:
3.2.1	Выбирать способы и средства измерений и проводить экспериментальные исследования.
3.3	Владеть:

3.3.1	Применения методов и способов разработки технических заданий для проектирования технологических процессов производства материалов и изделий электронной техники.
-------	--

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)						
Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература	Форма контроля
	Раздел 1. Введение в дисциплину.					
1.1	Цели и задачи дисциплины. Значение современных методов исследования структуры, их классификация. /Тема/	2	0			
1.2	Лекция 1 /Лек/	2	2	ПК-2.1-3 ПК-2.1-У	Л1.2 Л1.3 Л1.6Л2.2 Л2.3Л3.2 Э1	Контрольные вопросы
1.3	Основные методы структурного анализа. Физические явления и принципы, лежащие в основе методов структурного анализа и контроля качества материалов. Классификация механических и физических свойств материалов. /Тема/	2	0			
1.4	Лекция 2 /Лек/	2	2	ПК-2.1-3	Л1.4Л2.1 Л2.2Л3.2 Э2	Контрольные вопросы
	Раздел 2. Оптическая металлография.					
2.1	Основные типы металлографических микроскопов. Разрешающая способность и увеличение металлографического микроскопа. /Тема/	2	0			
2.2	Лекция 1 /Лек/	2	2	ПК-2.1-3	Л1.3 Л1.4 Л1.5Л3.2 Э1	Контрольные вопросы
2.3	Лабораторная работа 1 /Лаб/	2	4	ПК-2.1-3 ПК-2.1-В	Л1.2Л3.1 Л3.2 Э2	Отчет
2.4	Дефекты изображения при работе с металлографическим микроскопом. Объективы и окуляры для металлографических микроскопов. Основные методы металлографических исследований. /Тема/	2	0			
2.5	Лекция 2 /Лек/	2	2	ПК-2.1-3	Л1.4Л2.2Л3.1 Э3	Контрольные вопросы
2.6	Самостоятельная работа /Ср/	2	14	ПК-2.1-3	Л1.4Л3.1 Л3.5 Э3	Устный опрос
	Раздел 3. Растровая электронная микроскопия.					
3.1	Особенности растрового электронного микроскопа. Подготовка образцов для исследования. Применение растровой электронной микроскопии. /Тема/	2	0			
3.2	Лекция 1 /Лек/	2	2	ПК-2.1-3	Л1.3Л2.2Л3.2 Э3	Контрольные вопросы
3.3	Лабораторная работа 1 /Лаб/	2	2	ПК-2.1-3 ПК-2.1-В	Л1.1 Л1.4Л2.2 Э3	Отчет
3.4	Упражнение 1 /Пр/	2	4	ПК-2.1-3 ПК-2.1-В	Л1.3 Л1.4 Л1.5 Э1	Отчет
	Раздел 4. Сканирующая зондовая микроскопия.					

4.1	Перспективы развития сканирующей зондовой микроскопии. Сканирующая туннельная микроскопия. Зонды для туннельной микроскопии. /Тема/	2	0			
4.2	Лекция 1 /Лек/	2	2	ПК-2.1-3	Л1.1 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.3 Э1	Контрольные вопросы
4.3	Упражнение 1 /Пр/	2	4	ПК-2.1-3 ПК-2.1-В	Л1.4Л2.3Л3. 2 Э1	Отчет
4.4	Атомно-силовая микроскопия. Перемещение пьезосканеров. Устранение дефектов при работе зондовых микроскопов. /Тема/	2	0			
4.5	Лекция 2 /Лек/	2	2	ПК-2.1-3	Л1.3 Л1.6Л3.4 Э1	Контрольные вопросы
4.6	Лабораторная работа 2 /Лаб/	2	2	ПК-2.1-3 ПК-2.1-В	Л1.6Л2.1Л3. 2 Э1 Э2	Отчет
	Раздел 5. Энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия.					
5.1	Принципы метода. Устройство рентгеновского энергодисперсионного спектрометра. /Тема/	2	0			
5.2	Лекция 1 /Лек/	2	2	ПК-2.1-3	Л2.2 Л2.3Л3.2 Э1 Э2	Контрольные вопросы
5.3	Характеристики и возможности энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии. Техника применения энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии. /Тема/	2	0			
5.4	Самостоятельная работа /Ср/	2	17	ПК-2.1-3 ПК-2.1-В	Л1.5Л3.1 Л3.2 Э1	Устный опрос
5.5	Упражнение 1 /Пр/	2	4	ПК-2.1-3	Л1.3Л2.3Л3. 2 Э2	Отчет
5.6	Контактная работа /ИКР/	2	0,35	ПК-2.1-3	Л1.4Л2.2Л3. 2 Э1 Э2	Вопросы к экзамену
5.7	Контрольная работа /Экзамен/	2	16	ПК-2.1-3	Л1.3Л2.2Л3. 2 Э1	Вопросы к экзамену
	Раздел 6. Методы измерение удельного электрического сопротивления.					
6.1	Методы измерения электрического сопротивления. /Тема/	2	0			
6.2	Самостоятельная работа /Ср/	2	18	ПК-2.1-3	Л1.2 Л1.3Л3.2 Э3	Устный опрос
6.3	Метод вольтметра-амперметра. Мостовые методы измерения электросопротивления. Компенсационный метод. Измерения электрического сопротивления бесконтактными методами. /Тема/	2	0			
6.4	Самостоятельная работа /Ср/	2	8	ПК-2.1-3	Л1.1 Л1.5Л3.1 Э1	Устный опрос
6.5	Упражнение 1 /Пр/	2	4	ПК-2.1-3 ПК-2.1-В	Л1.3Л2.3Л3. 2 Э1	Отчет

6.6	Консультация /Кнс/	2	2	ПК-2.1-3	Л1.1Л3.1 Л3.5 Э1 Э2	Вопросы к экзамену
6.7	Экзамен /Экзамен/	2	28,65	ПК-2.1-3	Л1.3Л2.1Л3. 3 Э3	Вопросы к экзамену

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные материалы приведены в приложении к рабочей программе дисциплины (см. документ «Оценочные материалы по дисциплине «Методы исследования состава и структуры поверхности»).

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

№	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Количество/название ЭБС
Л1.1	Ханнинк Р.	Наноструктурные материалы : учебное пособие	Москва: Техносфера, 2009, 488 с.	978-5-94836-221-2, http://www.iprbookshop.ru/12730.html
Л1.2	Растворова И. И., Терехов В. Г., Растворова И. И.	Электроника и наноэлектроника : учебное пособие	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский горный университет, 2016, 205 с.	978-5-94211-763-4, http://www.iprbookshop.ru/71712.html
Л1.3	Легостаев Н. С.	Материалы электронной техники : учебное пособие	Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2014, 239 с.	978-5-86889-679-8, http://www.iprbookshop.ru/72057.html
Л1.4	Авачев А.П., Арефьев А.С., Гололобов Г.П., Суворов Д.В.	Сканирующая зондовая микроскопия : метод. указ. к лаб. работам	Рязань, 2010, 40с.	, 1
Л1.5	Вихров С.П., Вишняков Н.В.	Диагностика нанообъектов. Наноматериалы. Наноэлектроника	Рязань: Сервис, 2012, 208 с.	978-5-83403-059-3, 1
Л1.6	Бровер, Г. И., Пустовойт, В. Н., Бровер, А. В, Дука, В. В.	Методы структурного анализа материалов : учебно-методическое пособие	Ростов-на-Дону: Донской государственный технический университет, 2018, 144 с.	978-5-7890-1565-0, https://www.iprbookshop.ru/118058.html

6.1.2. Дополнительная литература

№	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Количество/название ЭБС
---	---------------------	----------	-------------------	-------------------------

№	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Количество/название ЭБС
Л2.1	Вихров С.П., Вишняков Н.В.	Нанотехнологии и их применение: в 2 ч. Ч.1. – Диагностика нанообъектов. Наноматериалы. Нанoeлектроника : Монография	Рязань: РИЦ РГРТУ, 2012,	, https://elib.rsr.eu.ru/ebs/download/506
Л2.2	Рыков С.А.	Сканирующая зондовая микроскопия полупроводниковых материалов и наноструктур : Учеб.пособие для вузов	СПб.:Наука, 2001, 52с.	5-02-024956-4, 1
Л2.3	Авачёв А. П., Вишняков Н. В., Гололобов Г. П., Митрофанов К. В.	Методические пособия для проведения лабораторных работ по направлению «Наноматериалы»	Рязань: РГРТУ, 2010, 58 с.	, https://e.lanbook.com/book/167964

6.1.3. Методические разработки

№	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Количество/название ЭБС
Л3.1	Рогачев С. О., Белов В. А.	Металлические композиционные и гибридные материалы. Гибридные наноструктурные материалы : учебное пособие	Москва: Издательский Дом МИСиС, 2018, 74 с.	978-5-906953-92-6, http://www.iprbookshop.ru/84411.html
Л3.2	Филимонова Н. И., Кольцов Б. Б.	Методы исследования микроэлектронных и нанoeлектронных материалов и структур. Сканирующая зондовая микроскопия. Часть I : учебное пособие	Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2013, 134 с.	978-5-7782-2158-1, http://www.iprbookshop.ru/45104.html
Л3.3	Игнатов А. Н.	Микросхемотехника и нанoeлектроника	Санкт-Петербург: Лань, 2011, 528 с.	978-5-8114-1161-0, https://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2035
Л3.4	Отв.ред.Кузнецов Ф.А.;Ин-т неорганической химии АН СССР.СО	Новые материалы электронной техники : Сб.науч.тр.	Новосибирск: Наука.СО, 1990, 158с.	5-02-029210-9, 1
Л3.5	Ханнинк, Р.	Наноструктурные материалы : учебное пособие	Москва: Техносфера, 2009, 488 с.	978-5-94836-221-2, https://www.iprbookshop.ru/12730.html

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1	Электронно-библиотечная система «IPRbooks»
Э2	Электронно-библиотечная система издательства «Лань»
Э3	Электронная библиотека РГРТУ

6.3 Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства

Наименование	Описание
Операционная система Windows	Коммерческая лицензия
Adobe Acrobat Reader	Свободное ПО

Академическая версия пакета LabVIEW 2009	Свободное ПО
VisualStudio Express	Свободное ПО
Gwyddon	Свободное ПО
Vertabelo - Онлайн инструмент для визуального проектирования баз данных	Свободное ПО
6.3.2 Перечень информационных справочных систем	
6.3.2.1	Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (договор об информационной поддержке №1342/455-100 от 28.10.2011 г.)
6.3.2.2	Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ http://www.garant.ru

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
1	209 лабораторный корпус. учебная аудитория для проведения учебных занятий, компьютерный класс Специализированная мебель (21 посадочных места), магнитно-маркерная доска. Мультимедиа проектор, 1 экран. ПК. Возможность подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду РГРТУ
2	213 лабораторный корпус. учебная аудитория для проведения учебных занятий. Специализированная мебель (26 посадочных места). Учебно-лабораторные стенды, RLC метры VC 9808, генераторы GRG-3015, осциллографы АКИП-4115/3А, магнито-маркерная доска
3	214 лабораторный корпус. учебная аудитория для проведения учебных занятий. Специализированная мебель (60 посадочных мест), магнитно-маркерная доска. Мультимедиа проектор, 1 экран. ПК.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
Методическое обеспечение дисциплины приведено в приложении к рабочей программе дисциплины (см. документ «Методические указания дисциплины «Методы исследования состава и структуры поверхности»).

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ПОДПИСАНО
ЗАВЕДУЮЩИМ
КАФЕДРЫ**ФГБОУ ВО "РГРТУ", РГРТУ**, Круглов Сергей
Александрович, Заведующий кафедрой ПЭЛ**17.06.26** 15:03 (MSK)

Простая подпись

ПОДПИСАНО
ЗАВЕДУЮЩИМ
ВЫПУСКАЮЩЕЙ
КАФЕДРЫ**ФГБОУ ВО "РГРТУ", РГРТУ**, Круглов Сергей
Александрович, Заведующий кафедрой ПЭЛ**17.06.26** 15:03 (MSK)

Простая подпись